



Guía de Ejercicios N^o 2: Juntura PN

Constante	Valor
q	$1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
m_0	$9,109 \times 10^{-31} \text{ kg}$
k	$1,381 \times 10^{-23} \text{ J/K} = 8,617 \times 10^{-5} \text{ eV K}$
h	$6,626 \times 10^{-34} \text{ Js} = 4,136 \times 10^{-15} \text{ eV s}$
ϵ_0	$8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m} = 88,5 \text{ fF/cm} = 8,85 \cdot 10^{-14} \text{ F/cm}$
$\epsilon_r(\text{Si})$	11,7
$\epsilon_r(\text{SiO}_2)$	3,9
T_{amb}	$27^\circ\text{C} = 300 \text{ K}$

Cuadro 1: Datos útiles.

Parte I: Electrostatica de la juntura PN

- ✓ 1. Considere una juntura PN de silicio a 300 K.
 - a) Para $N_A = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ y $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ calcule el potencial de juntura (ϕ_B).
 - b) Repita para $N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ y $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$.
 - c) Entre los puntos a) y b) el valor de N_A se ha reducido en cien veces. ¿En qué porcentaje varió el potencial de juntura? ¿Qué conclusión puede obtener?
- ✓ 2. Considere una juntura PN de silicio a 300 K con $N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ y $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. Calcule:
 - a) El ancho de la zona de carga espacial.
 - b) El valor del campo eléctrico máximo.
- ✓ 3. Considere la juntura PN de silicio a 300K del problema 2 con una tensión aplicada $V_{PN} = V_P - V_N$, donde V_P es la tensión aplicada al lado P y V_N la tensión aplicada al lado N. Calcular los siguientes parámetros cuando se tiene una polarización inversa de $V_{PN} = -5 \text{ V}$:
 - a) El ancho de la zona de carga espacial.
 - b) El valor del campo eléctrico máximo.
 - c) Repita los puntos anteriores considerando que ahora se encuentra polarizado en directa con una tensión $V_{PN} = 0,5 \text{ V}$.
 - d) Compare estos resultados con los del problema 2.
- ✓ 4. Considere una juntura PN de silicio a 300 K con $N_A = 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ y $N_D = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$.
 - a) ¿Qué es la aproximación de vaciamiento? ¿Como sirve para obtener la distribución de carga en la juntura?
 - b) Para la condición de equilibrio térmico, y bajo la aproximación de vaciamiento, realice los diagramas de
 - I. concentración de dopantes N_A y N_D ,
 - II. concentración de portadores libres n_0 y p_0 (en escala lineal y semilogarítmica),
 - III. densidad de carga neta ρ ,
 - IV. campo eléctrico,
 - V. potencial electrostático.
 - c) Repita el punto anterior para tensiones de inversa de -5 V y -10 V .



- ✓ 5. Considere una juntura PN en equilibrio térmico ($T = 300\text{K}$) con las siguientes características: $\phi_B = 536.2\text{ mV}$; $x_n = 251\text{ nm}$; $x_p = 2.51\text{ }\mu\text{m}$. ¿Cuál son los valores de las concentraciones de impurezas?
- ✓ 6. Considere una juntura PN de silicio a 300K con $N_A = 10^{19}\text{ cm}^{-3}$ y $N_D = 10^{17}\text{ cm}^{-3}$. Si el campo eléctrico máximo admitido es $|E_{MAX}| = 5 \times 10^5\text{ V/cm}$, ¿Cuál es el máximo valor de tensión en inversa admisible?

Parte II: Capacidad de juntura

- ✓ 7. Suponga que la juntura PN del problema 2 tiene un área de $A = 10^{-4}\text{ cm}^2$. Calcule la capacidad de la juntura para una polarización inversa de -5 V .
- ✓ 8. Para una juntura PN simétrica con $\phi_B = 0.9\text{ V}$, calcular C'_{j0} , N_D y N_A .
- ✓ 9. Se conoce que la capacidad de una juntura P+N es $C'_{j0} = 29\text{ nF/cm}^2$ y que $\phi_B = 840\text{ mV}$. Hallar ϕ_n , ϕ_p , N_A y N_D .
- ✓ 10. Dada una juntura P+N de silicio a 300K . Asuma que la intersección de la curva de la Fig. 1 con el eje horizontal corresponde a un potencial de juntura de 0.855 V y que la pendiente de la recta es $-10^{15}\text{ (F/cm}^2\text{)}^{-2}/\text{V}$. Calcule la concentración de impurezas N_A y N_D de la juntura.

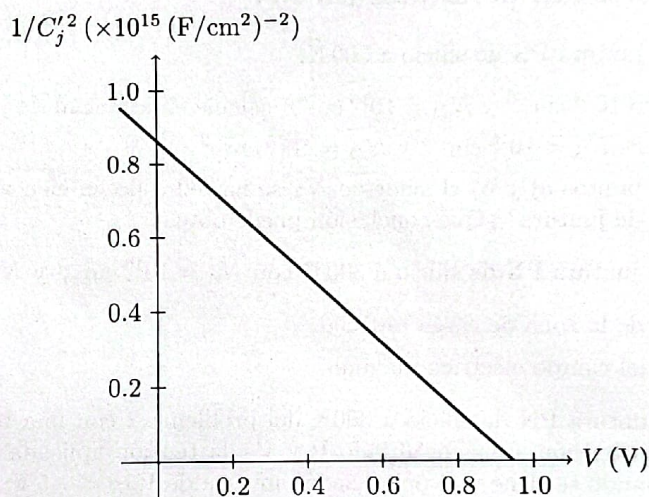


Figura 1

Parte III: Ejercicios integradores

- ✓ 11. Se tiene una juntura PN de silicio de la cual se conocen las conductividades de la zona N ($\sigma_N = 48\text{ }\Omega^{-1}\text{cm}^{-1}$) y zona P ($\sigma_P = 15,36 \times 10^{-3}\text{ }\Omega^{-1}\text{cm}^{-1}$), el campo eléctrico máximo $|E_0| = 6,7\text{ kV/cm}$ y ancho de la zona de vaciamiento $x_{d0} = 2,17\text{ }\mu\text{m}$
 - a) ¿La juntura es simétrica, asimétrica o fuertemente asimétrica? ¿Por que? Justificar y mencionar cualquier aproximación usada.
 - b) Si la carga a ambos lados de la juntura es 7 nC/cm^2 en valor absoluto, hallar las movilidades de huecos y electrones a ambos lados de la juntura.
- ✓ 12. Considere una juntura PN de silicio a 300 K con una concentración de $N_A = 10^{18}\text{ cm}^{-3}$.
 - a) ¿Cuáles son los límites de ϕ_B para una Juntura PN? ¿Por qué?
 - b) Teniendo en cuenta lo analizado en el punto anterior, determine la concentración N_D tal que para una tensión de inversa de $V_{PN} = -45\text{ V}$ el campo eléctrico máximo sea $|E_{MAX}| = 3 \times 10^5\text{ V/cm}$.



- c) Si se desea que el campo eléctrico máximo no supere el valor $|E_{MAX}| = 3 \times 10^5$ V/cm, conservando $N_A = 10^{18}$ cm⁻³, el valor de N_D hallado en el punto a) ¿es una cota máxima o una cota mínima de concentración de dopantes donores?
- ✓ 13. Se tiene una juntura P⁺N donde se sabe que sin potencial aplicado, el máximo valor que alcanza el campo eléctrico es $|E_0| = 10$ kV/cm y que $N_D = 4.5 \times 10^{14}$ cm⁻³ ($T = 300$ K).
- a) ¿Cuál es la concentración N_A de la juntura?
- b) Sabiendo que el $|E|$ de ruptura de silicio es 170 kV/cm, ¿cuál es el máximo valor de N_A que puede utilizarse en esta juntura?
- c) Suponiendo ahora que $N_D = 10^{17}$ cm⁻³, ¿cuál es el máximo valor de N_A que puede utilizarse en esta nueva juntura? (Considerar juntura P⁺N)
- d) Explique la siguiente afirmación: "Dado que el valor de ϕ_B es siempre aproximadamente 1 V, mayores concentraciones de dopantes implicarán menores valores de x_p y x_n y en consiguiente obtener la misma diferencia de potencial en menor distancia implicará necesariamente un mayor valor de campo eléctrico en la juntura".
- X 14. De una juntura muy asimétrica PN⁺ con area $A = 0.5$ mm, se tienen las siguientes mediciones de capacidad en polarización inversa:

V_{PN} [V]	C_j [pF]
-1	3.6
-2	2.6
-3	2.4

- a) ¿Por qué disminuye el valor de la capacidad a medida que aumenta la tensión inversa aplicada?
- b) Obtenga las concentraciones de impurezas N_A y N_D y el potencial de built-in (ϕ_B).
- X 15. Diseñe una juntura PN de silicio con un área de $A = 5.5 \times 10^{-4}$ cm² tal que a 300K y para una polarización inversa de $V_{PN} = -1.2$ V verifique que el 10% del total de la zona de carga espacial esté en la región N, y que su capacidad de juntura sea 3.5 pF.
- a) Determine las concentraciones N_D y N_A necesarias.
- b) Determine el potencial de juntura resultante.

■ Guía N°2: Juntura PN

• Parte I: Electroestática de la juntura PN

1. a) En equilibrio térmico, es posible obtener el potencial mediante la relación de Boltzmann,

tal que:

$$\text{en QNR-P: } p_0 = N_a \Rightarrow \phi_p = -\frac{kT}{q} \ln \frac{N_a}{n_i}$$

$$\text{en QNR-N: } n_0 = N_d \Rightarrow \phi_n = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_d}{n_i}$$

A lo cual, se llega a que el potencial de juntura ϕ_B vale:

$$\phi_B = \phi_n - \phi_p = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_a N_d}{n_i^2} \quad n_{i0} = 6,822 \cdot 10^9 \text{ cm}^{-3}$$

*Esta es una expresión general, para lo cual nos se emplea la aproximación de variamiento.

$$\phi_B = \frac{1,381 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot 300 \text{ K}}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}} \cdot \ln \left(\frac{10^{18} \text{ cm}^{-3} \cdot 10^{25} \text{ cm}^{-3}}{(6,822 \cdot 10^9 \text{ cm}^{-3})^2} \right)$$

$$\phi_B = 0,7939 \text{ V} \approx 800 \text{ mV}$$

*re cordar $\frac{J_{\text{elec}}}{C_{\text{coulomb}}} = V_{\text{volt}}$

$$b) \phi_B = \frac{1,381 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot 300 \text{ K}}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}} \cdot \ln \left(\frac{10^{16} \text{ cm}^{-3} \cdot 10^{25} \text{ cm}^{-3}}{(6,822 \cdot 10^9 \text{ cm}^{-3})^2} \right)$$

$$\phi_B = 0,6748 \text{ V} \approx 675 \text{ mV}$$

Para calcular el porcentaje de variación

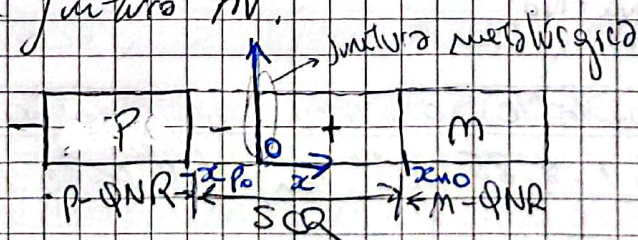
$$\text{Variación} = \left| \frac{\text{Valor nuevo} - \text{Valor viejo}}{\text{Valor viejo}} \right| \cdot 100\%$$

Entonces:

$$\text{Variación} = \left| \frac{0,6748\text{V} - 0,7939\text{V}}{0,7939\text{V}} \right| \cdot 100\% = \boxed{15\%}$$

El potencial de juntura varió un 15%, esto se debe a que disminuye la concentración de aceptores con respecto a su concentración original, por lo que el potencial ϕ_p , que depende del dopaje NA disminuye. Entonces, la diferencia de potencial con respecto a ϕ_m será menor, puesto que no se mantiene constante.

2.0(a) En una juntura PN en equilibrio hay una región de carga espacial rodeada por dos regiones casi neutras, lo que genera un potencial de juntura en un juntura PN.



Para obtener x_{n0} y x_{p0} (metas que en el sistema de referencia toma x_{p0} como positivo y se expresa en menos)

$$x_{n0} = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s \phi_0 N_A}{q (N_A + N_D) N_D}} \quad x_{p0} = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s \phi_0 N_D}{q (N_A + N_D) N_A}} \quad * F = \frac{C}{V}$$

El ancho total de la región de carga espacial es:

$$x_{do} = x_{n0} + x_{p0} = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s \phi_0 (N_A + N_D)}{q N_A N_D}} \quad \phi_0 \text{ fue calculado en el d. b.}$$

$$x_{do} = \sqrt{\frac{2 \cdot 11,7 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m} \cdot 0,6748V \cdot (10^{16} \text{ cm}^{-3} + 10^{25} \text{ cm}^{-3})}{1,602 \cdot 10^{-19} C \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3} \cdot 10^{25} \text{ cm}^{-3}}}$$

$$x_{do} = 9,7956 \cdot 10^{-3} \text{ cm}$$

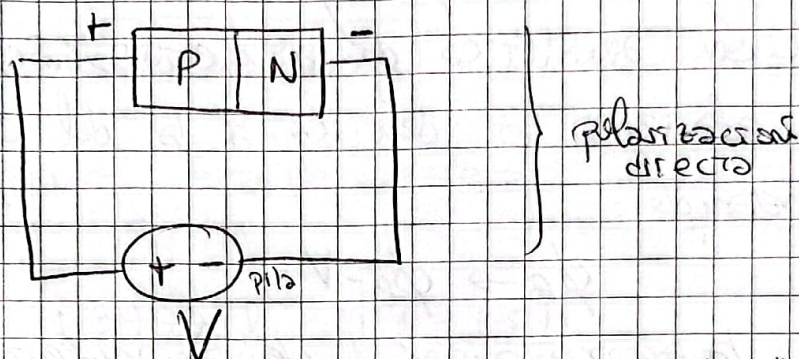
(b) El campo eléctrico es máximo en la junta metalorgánica y se calcula como:

$$|E_0| = \sqrt{\frac{2 q \phi_0 N_A N_D}{\epsilon_s (N_A + N_D)}}$$

$$|E_0| = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} C \cdot 0,6748V \cdot 10^{16} \cdot 10^{25} \text{ cm}^{-3} \text{ cm}^{-3}}{11,7 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m} \cdot (10^{16} \text{ cm}^{-3} + 10^{25} \text{ cm}^{-3})}} \cdot 10^6 \frac{V}{m}$$

$$|E_0| = 1,3777 \frac{V}{m}$$

3. a) Convención de signos para la tensión de polarización de la juntura PN



En polarización directa $V > 0$ y "p" es el lado positivo y "n" del lado negativo.

En polarización inversa $V < 0$ y "p" es el lado negativo y "n" del lado positivo.

Al aplicar una diferencia de potencial entre los bornes de la zona desierta (o SCR):

o en equilibrio: ϕ_B

o en polarización directa: $\phi_B - V < \phi_B$

o en polarización inversa: $\phi_B - V > \phi_B$ (ya que $V < 0$)

En directa, la diferencia de potencial en la zona desierta disminuye, entonces $|E|$ disminuye y, por lo tanto, x_d disminuye.

En inversa, la diferencia de potencial en la zona desierta aumenta, entonces $|E|$ aumenta y x_d aumenta.

Cualitativamente, la electrostática de la juntura PN polarizada no se modifica cualitativamente respecto del equilibrio térmico. Se modifica

el diodo de carga en la zona desértica (SCR) de modo de compensar el potencial forzado externamente. De todo esto, se concluye que:
 La formulación analítica de la electrostática de la juntura PN polarizada es idéntica a la del equilibrio térmico, pero considerando:

$$\phi_B \rightarrow \phi_B - V$$

utilizando la aproximación de Debye-Hückel:

$$x_n(V) = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s (\phi_B - V) N_a}{q (N_a + N_d) N_d}}$$

$$x_p(V) = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s (\phi_B - V) N_d}{q (N_a + N_d) N_a}}$$

$$x_d(V) = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s (\phi_B - V) (N_a + N_d)}{q N_a N_d}} = x_n + x_p$$

$$|E|(V) = \sqrt{\frac{2 q (\phi_B - V) N_a N_d}{\epsilon_s (N_a + N_d)}}$$

también se puede reescribir en función de los valores sin tensión V aplicada:

$$x_n(V) = x_{n0} \sqrt{1 - \frac{V}{\phi_B}}$$

$$x_p(V) = x_{p0} \sqrt{1 - \frac{V}{\phi_B}}$$

$$x_d(V) = x_{d0} \sqrt{1 - \frac{V}{\phi_B}}$$

$$|E|(V) = |E_0| \sqrt{1 - \frac{V}{\phi_B}}$$

Entonces, con los resultados del problema 2:

$$x_d(-5V) = 9,7956 \cdot 10^{-3} \text{ cm} \cdot \sqrt{\frac{1 - (-5)}{0,6748}}$$

$$x_d(-5V) = 0,0284 \text{ cm}$$

Aumento, como era de esperarse.

$$|E|(-5V) = 1,3777 \frac{V}{m} \cdot \sqrt{\frac{1 - (-5)}{0,6748}}$$

$$|E|(-5V) = 3,995 \frac{V}{m}$$

c) El procedimiento es similar

$$x_d(0,5) = 9,7956 \cdot 10^{-3} \text{ cm} \cdot \sqrt{\frac{1 - (0,5)}{0,6748}}$$

$$x_d = 4,9855 \cdot 10^{-3} \text{ cm}$$

$$|E|(0,5) = 1,3777 \frac{V}{m} \cdot \sqrt{\frac{1 - (0,5)}{0,6748}}$$

$$|E|(0,5) = 0,7011 \frac{V}{m}$$

d) Se realizó una explicación detallada en el punto (a), aunque como puede observarse, en inversa aumentan los valores y en directa disminuyen. Se modificó el dipolo de carga en la zona desierta (sc) a modo de compensar el potencial fijo externo.

Entonces, con los resultados del problema 2:

$$x_d(-5V) = 9,7956 \cdot 10^{-3} \text{ cm} \cdot \sqrt{\frac{1 - (-5)}{0,6748}}$$

$$x_d(-5V) = 0,0284 \text{ cm}$$

Aumento, como era de esperarse.

b)

$$|E|(-5V) = 1,3777 \frac{V}{m} \cdot \sqrt{\frac{1 - (-5)}{0,6748}}$$

$$|E|(-5V) = 3,995 \frac{V}{m}$$

c) El procedimiento es similar

$$x_d(0,5) = 9,7956 \cdot 10^{-3} \text{ cm} \cdot \sqrt{\frac{1 - (0,5)}{0,6748}}$$

$$x_d = 4,9855 \cdot 10^{-3} \text{ cm}$$

$$|E|(0,5) = 1,3777 \frac{V}{m} \cdot \sqrt{\frac{1 - (0,5)}{0,6748}}$$

$$|E|(0,5) = 0,7011 \frac{V}{m}$$

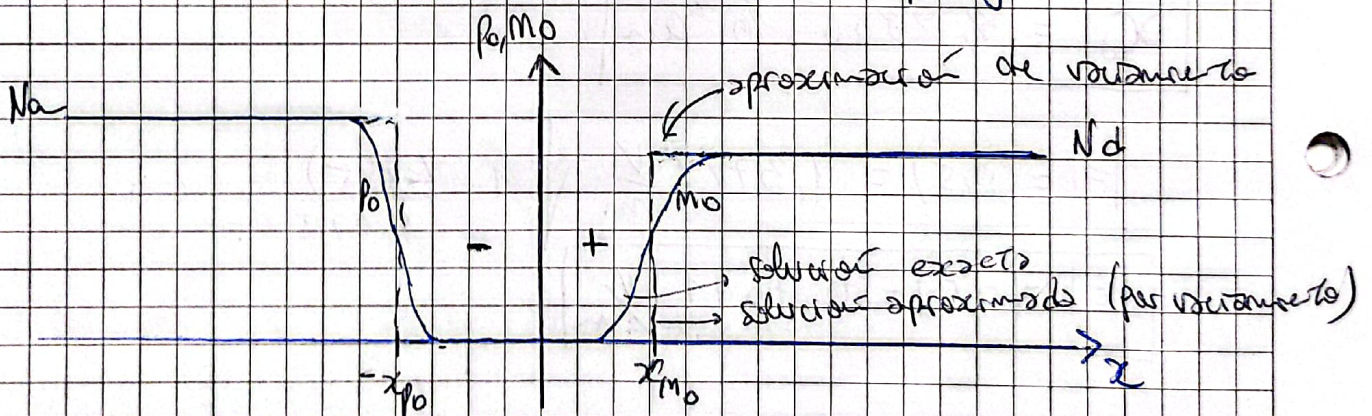
d) Se realizó una explicación detallada en el punto (a), siempre como puede observarse, en inversa aumentan los valores y en directa disminuyen. Se modificó el dipolo de carga en la zona desierta (s02) a modo de comparar el potencial forzado externamente.

4. (a) La aproximación de variaciones consiste en suponer que la práctica totalidad de la carga existente en la zona SCR es debida a impurezas ionizadas no compensadas, consiste en despreciar la carga debida a los portadores móviles / libres ya que sus concentraciones son mucho menores que el dopaje:

- Se asume que las QNR's tienen neutralidad de carga.

- Se asume que los SCR están vacíos de portadores (región de vaciamiento)

- La transición entre SCR y QNR's es abrupta (x debe calcular donde cambia $-x_{p0}$ y x_{m0}).



Entonces:

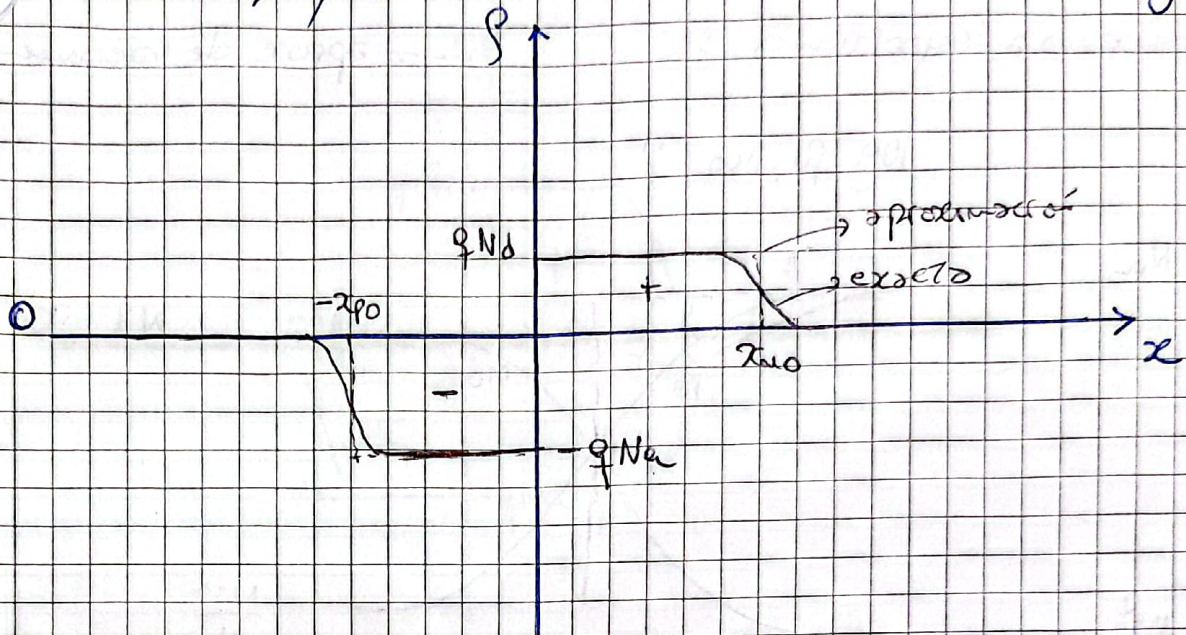
$$x < -x_{p0} \Rightarrow \rho_0(x) = -N_a ; \phi_0(x) = \frac{M_i^2}{N_a}$$

$$-x_{p0} < x < 0 \Rightarrow \rho_0(x), \phi_0(x) < N_a$$

$$0 < x < x_{m0} \Rightarrow \rho_0(x), \phi_0(x) < N_d$$

$$x_{m0} < x \Rightarrow \rho_0(x) = N_d, \phi_0(x) = \frac{M_i^2}{N_d}$$

(b) Finalmente, para obtener la distribución de carga espacial:



Entonces:

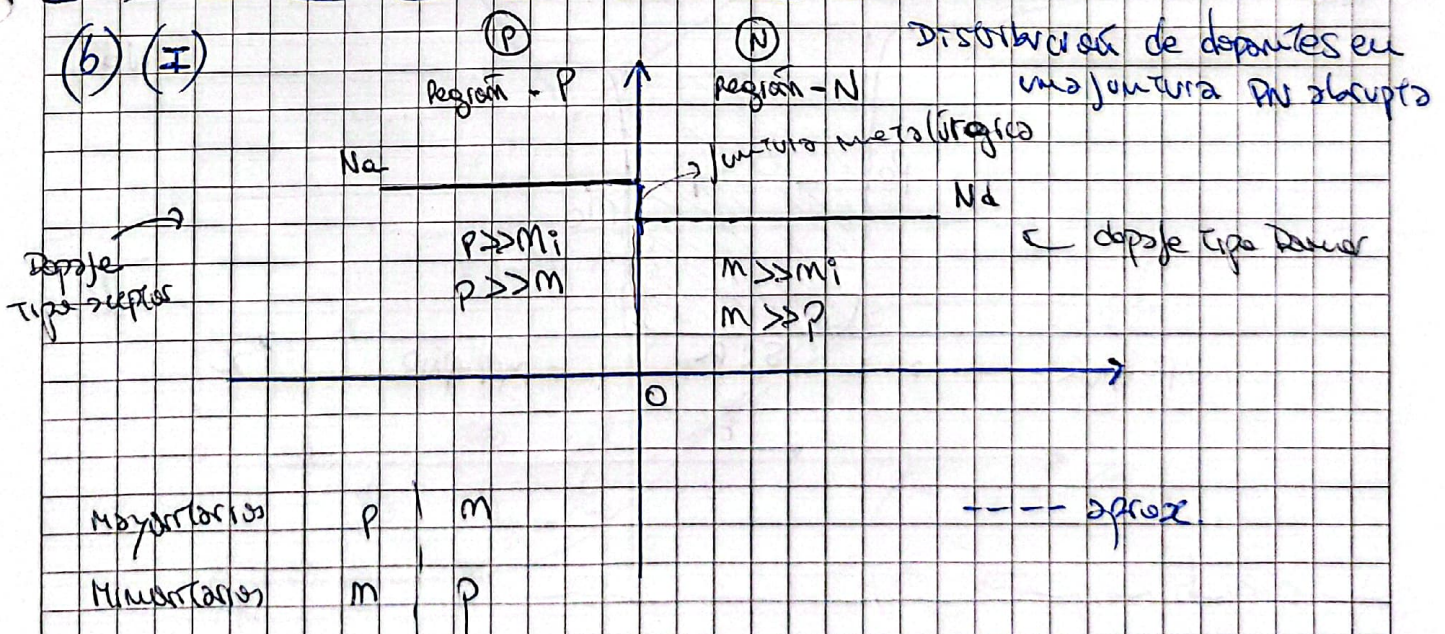
$$\rho(x) = 0 \quad \text{si } x < -x_{p0}$$

$$\rho(x) = -\rho_{Na} \quad \text{si } -x_{p0} < x < 0$$

$$\rho(x) = \rho_{Nd} \quad \text{si } 0 < x < x_{m0}$$

$$\rho(x) = 0 \quad \text{si } x_{m0} < x$$

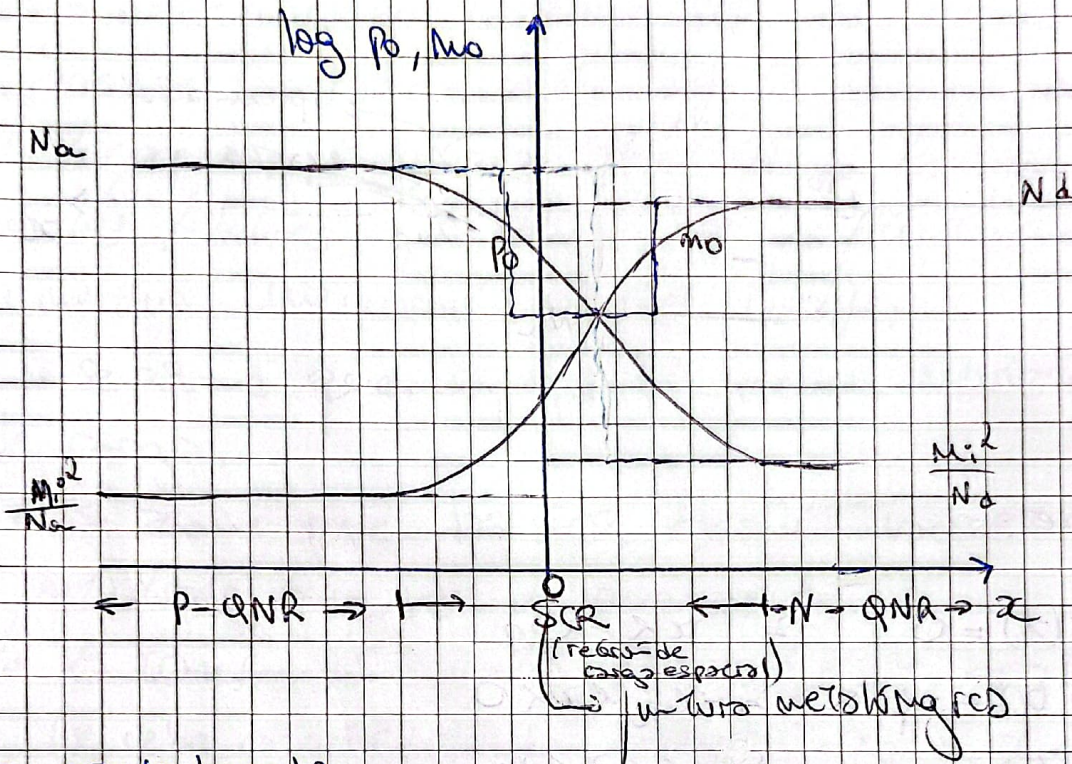
(b) (I)



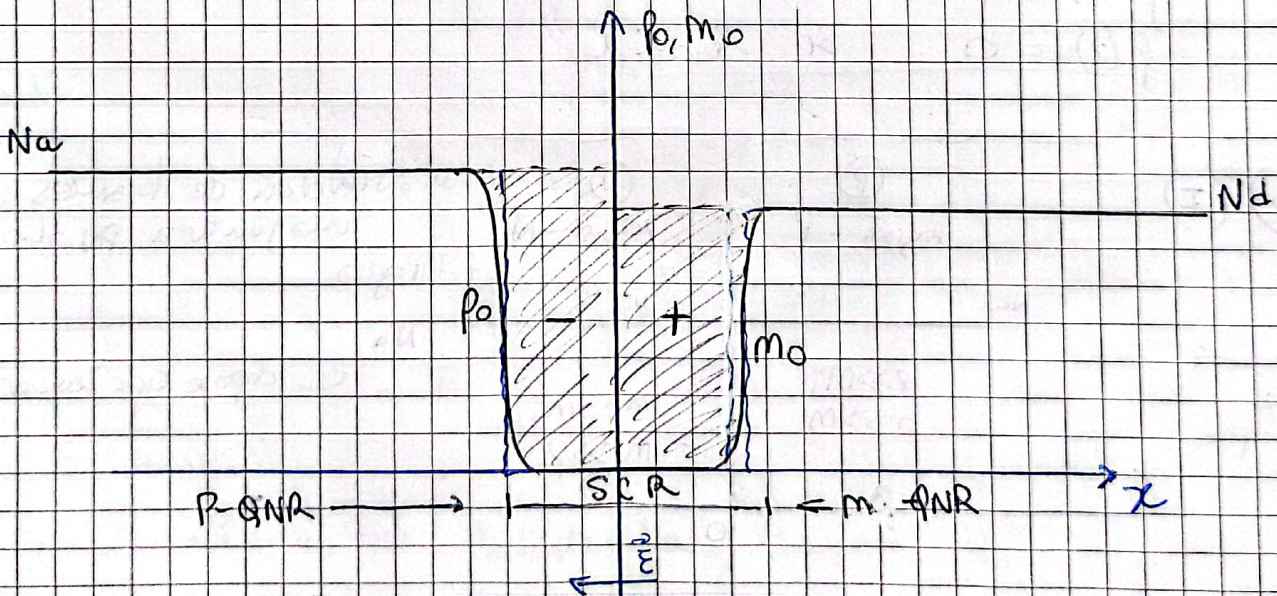
II. Distribución de portadores en equilibrio térmico

En escala logarítmica:

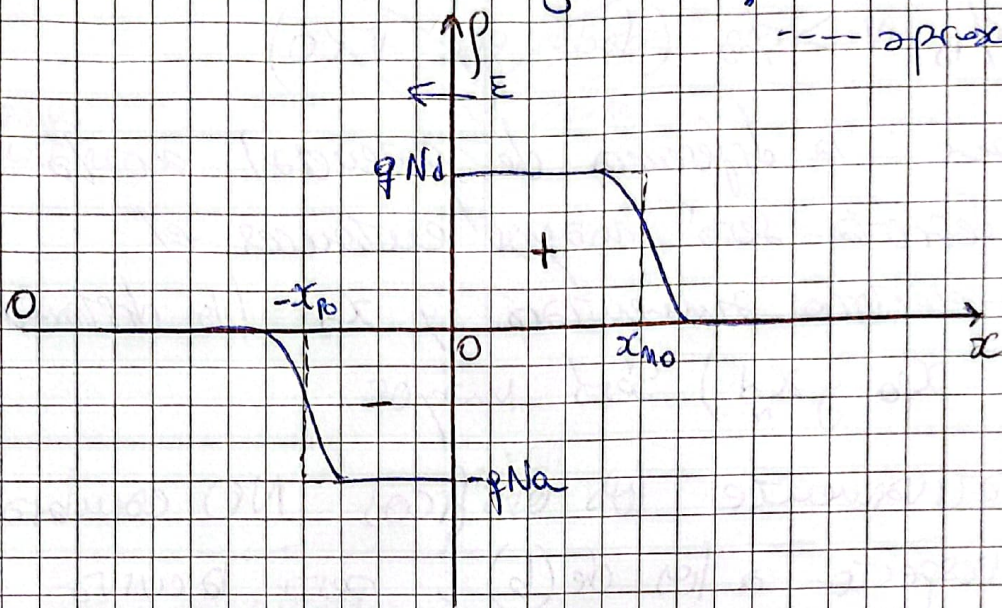
--- aprox de vómito



En escala lineal:

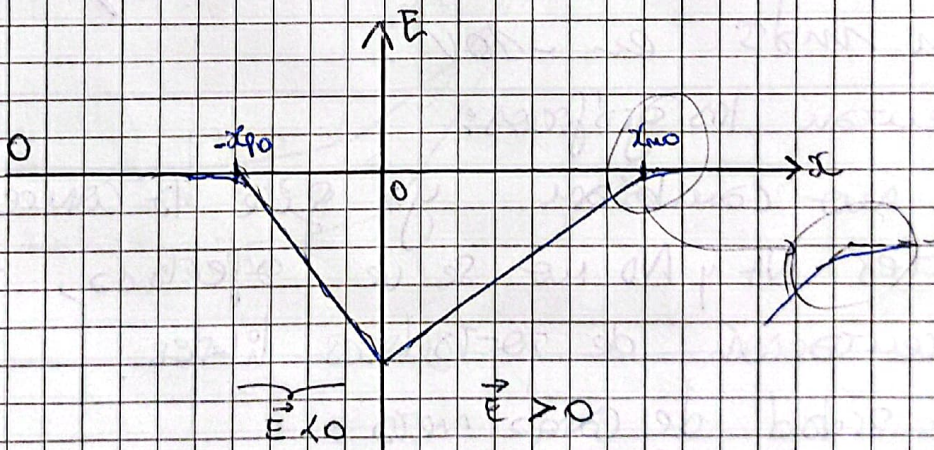


III. Densidad de carga neta ρ



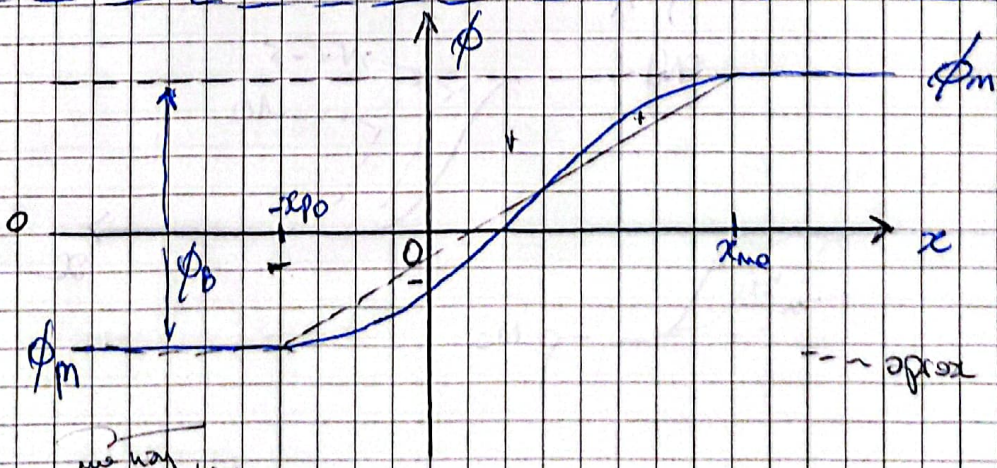
--- aprox de vacuante

IV.



--- aprox de vacuante

V.



--- aprox de vacuante

no hay campo electrico, no cambio el potencial

no hay campo electrico, no cambio el potencial

c) En polarización inversa

$$\phi_B - V > \phi_B \quad (\text{dado que } V < 0)$$

Por lo que la diferencia de potencial en la zona de depleción será mayor entonces el campo eléctrico aumentará y x_d (la distancia entre x_p y x_n) será mayor.

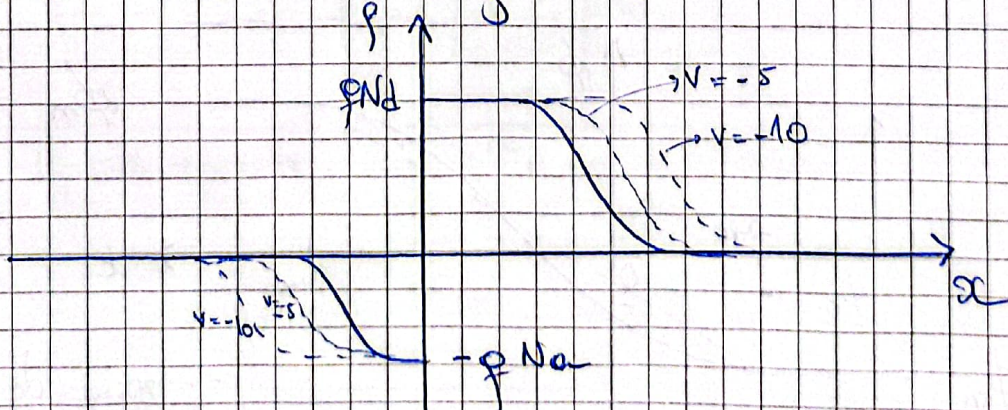
Cualitativamente los gráficos NO cambiarán con respecto a los de (b), pero la curva se desplazará hacia la zona de decrecimiento de la variable.

Dado que $-10V < -5V$, se desplazará aún más en $-10V$.

Se presentan los gráficos:

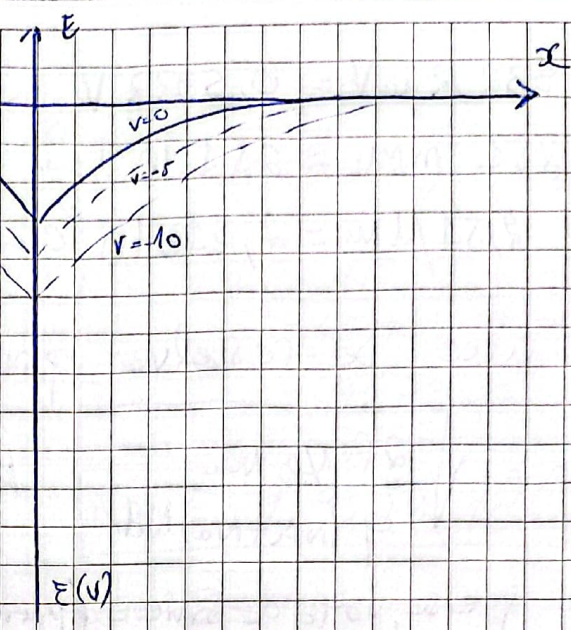
I y II no cambian ya que la concentración de dopantes N_A y N_D no se ve afectada, tampoco la concentración de portadores libres.

III. Densidad de carga neta

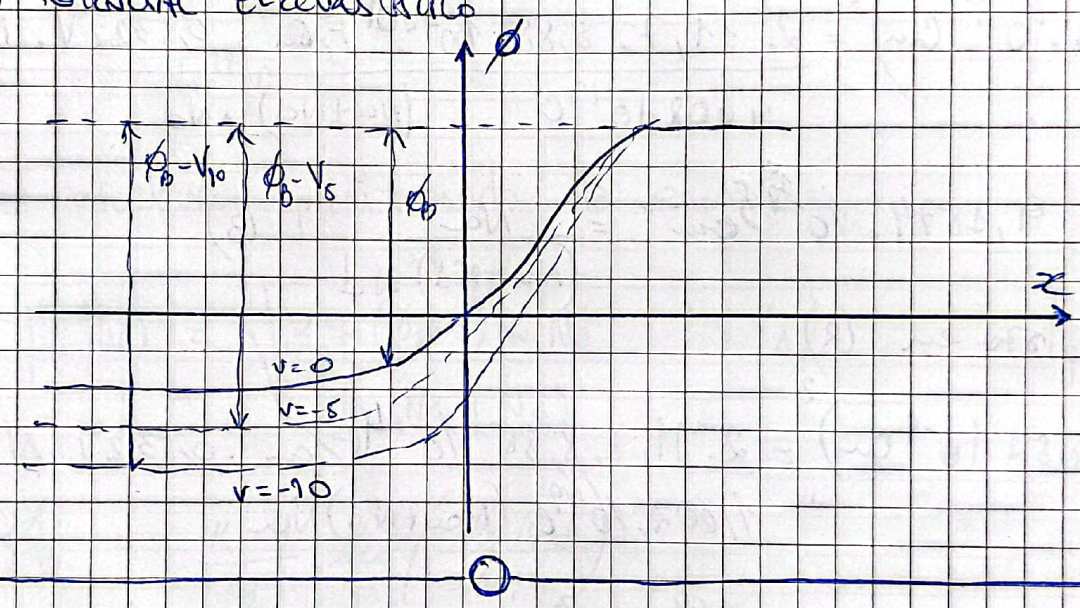


IV

CAMPO ELÉCTRICO



V_0 POTENCIAL ELÉCTROSTÁTICO



$$5. \phi_B = 532,2 \text{ mV} = 0,5322 \text{ V}$$

$$x_n = 251 \text{ mm} = 251 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 251 \cdot 10^{-7} \text{ cm} = 2,51 \cdot 10^{-5} \text{ cm}$$

$$x_p = 2,51 \text{ mm} = 2,51 \cdot 10^{-4} \text{ cm}$$

Este ejercicio se resuelve planteando:

$$(1) \quad x_{n0} = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s \phi_B N_a}{q (N_a + N_d) N_d}}$$

$$(2) \quad x_{p0} = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s \phi_B N_d}{q (N_a + N_d) N_a}}$$

Supongo que se trata de silicio (para ϵ_s)
reemplazo en (1)

$$(2,51 \cdot 10^{-5} \text{ cm})^2 = \frac{2 \cdot 11,7 \cdot 8,85 \cdot 10^{-14} \text{ F/cm} \cdot 0,5322 \text{ V} \cdot N_a}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} (N_a + N_d) N_d}$$

$$9,1574 \cdot 10^{-13} \text{ cm}^3 = \frac{N_a}{(N_a + N_d) N_d} \quad (3)$$

reemplazo en (2)

$$(2,51 \cdot 10^{-4} \text{ cm})^2 = \frac{2 \cdot 11,7 \cdot 8,85 \cdot 10^{-14} \text{ F/cm} \cdot 0,5322 \text{ V} \cdot N_d}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} (N_a + N_d) N_a}$$

$$9,1574 \cdot 10^{-19} \text{ cm}^3 = \frac{N_d}{(N_a + N_d) N_a} \quad (4)$$

Divido (3) por (4)

$$0,01 = \frac{N_a^2 (N_a + N_d)}{N_d^2 (N_a + N_d)}$$

$$0,01 N_d^2 = N_a^2 \Rightarrow 0,1 N_d = N_a \quad \rightarrow \text{tomar valores positivos}$$

Despeje de (4)

$$9,1574 \cdot 10^{-19} \text{ cm}^{-3} = \frac{A_{\text{Si}}}{(0,1 N_d + N_d) 0,1 A_{\text{Si}}}$$

$$1,1 A N_d = \frac{10}{9,1574 \cdot 10^{-19} \text{ cm}^{-3}}$$

$$N_d = 9,9273 \cdot 10^{-18} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_a = 9,9273 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$$

6. $T = 300 \text{ K}$ Silicio

$$N_a = 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_d = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$$

Se resuelve planteando la ecuación

$$|\varepsilon(V)| = \sqrt{\frac{2q(\phi_B - V) N_a N_d}{\epsilon_s (N_a + N_d)}} \quad (1)$$

$$\phi_B = \frac{k T}{q} \ln \left(\frac{N_a N_d}{n_i^2} \right)$$

$$n_i = 6,822 \cdot 10^9 \text{ cm}^{-3}$$

$$k = 1,382 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

$$\phi_B = \frac{1,382 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}} \cdot 300 \text{ K}}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}} \ln \left(\frac{10^{19} \text{ cm}^{-3} \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}}{(6,822 \cdot 10^9 \text{ cm}^{-3})^2} \right)$$

$$\phi_B = 0,9725 \text{ V} \quad (2)$$

resolver (1) con (2) y (3) (100).

$$|E_{max}| = 5 \cdot 10^5 \text{ V/cm} \geq \sqrt{\frac{2 \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} (0,9725 \text{ V} - V) \cdot 10^{19} \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-6}}{11,7 \cdot 8,85 \cdot 10^{-14} \text{ F/cm} \cdot (10^{19} \text{ cm}^{-3} + 10^{17} \text{ cm}^{-3})}}$$

$$\boxed{-8,16 \cdot 10^5 \text{ V/cm} \leq V \leq 0} \quad \left. \vphantom{\boxed{-8,16 \cdot 10^5 \text{ V/cm} \leq V \leq 0}} \right\} \text{valor que daó negligibles como en inversa}$$

Parte II: Capacidad de juntura

7. Modificar la tensión aplicada externamente a la juntura PN modifica el ancho total de la zona de variamiento. Dicha variación genera una variación en la densidad de carga y por ende puede asociarse a una capacidad.

Se produce un cambio en ΔV entre los bds de la juntura:

\Rightarrow Cambio de AQ_j en $-x_p$

\Rightarrow Cambio de $-AQ_j$ en x_n

Entonces, se define la capacidad de juntura por unidad de área (usando aprox. de variamiento):

$$C_j'(V) = \frac{C_s}{x_d(V)} = \sqrt{\frac{q \epsilon_s N_a N_d}{2(\phi_0 - V)(N_a + N_d)}} = \frac{C_{j0}}{\sqrt{1 - \frac{V}{\phi_0}}} \quad [C_j'] = \frac{F}{\text{cm}^2}$$

\nearrow mayor tensión aplicada aumenta la capacidad y viceversa.

$$C_j'(V) = \frac{\epsilon_s}{x_d(V)} = \sqrt{\frac{q\epsilon_s N_a N_d}{2(\phi_B - V)(N_a + N_d)}} = \frac{C_{j0}}{\sqrt{1 - \frac{V}{\phi_B}}}$$

Considerando el área A de la juntura, la capacidad es:

$$[C_j] = F, \quad C_j(V) = A \cdot C_j'(V) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{es proporcional al} \\ \text{área de la juntura.} \end{array} \right.$$

C_j depende de la tensión de polarización aplicada (porque x_d depende) y del dopaje (N_a, N_d aumentan, entonces C_j aumenta).

Entonces, con respecto al ejercicio:

$$A = 10^{-4} \text{ cm}^2$$

$$V = -5 \text{ V}$$

$$N_a = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_d = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

$$\phi_B = 0,6748 \text{ V}$$

$$C_j'(-5V) = \sqrt{\frac{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3} \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3} \cdot 11,7 \cdot 8,85 \cdot 10^{-14} \text{ F/cm}}{2(0,6748 - (-5)) (10^{16} \text{ cm}^{-3} + 10^{15} \text{ cm}^{-3})}}$$

$$C_j'(-5V) = 3,6450 \cdot 10^{-9} \frac{\text{F}}{\text{cm}^2}$$

Entonces

$$C_j(-5V) = 10^{-4} \text{ cm}^2 \cdot 3,6450 \cdot 10^{-9} \frac{\text{F}}{\text{cm}^2}$$

$$C_j(-5V) = 3,6450 \cdot 10^{-13} \text{ F}$$

8. En una juntura PN simétrica $N_a = N_d \Rightarrow x_{p0} = x_{n0}$

$$\phi_B = 0,9V$$

Supongo que el material es silicio.

$$\phi_B = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_a N_d}{n_i^2} \right)$$

$$0,9V = \frac{1,381 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \cdot 300K}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}} \ln \left(\frac{N_a^2}{(6,822 \cdot 10^9 \text{ cm}^{-3})^2} \right)$$

$$\boxed{2,4593 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3} = N_a = N_d}$$

$$C_j'(V) = \sqrt{\frac{q \epsilon_s N_a N_d}{2(\phi_B - V)(N_a + N_d)}} \quad \text{si } V=0 \Rightarrow C_{j0}' = \sqrt{\frac{q \epsilon_s N_a N_d}{2 \phi_B (N_a + N_d)}}$$

$$C_{j0}' = \sqrt{\frac{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 11,7 \cdot 8,85 \cdot 10^{-14} \text{ F/cm} \cdot (2,4593 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3})^2}{2 \cdot 0,9V \cdot (2,4593 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3} \cdot 2)}}$$

$$\boxed{C_{j0}' = 1,0645 \cdot 10^{-4} \frac{\text{F}}{\text{cm}^2}}$$

9. Una juntura P⁺N significa que el lado P está mucho más dopado que el lado N, es decir es una juntura muy asimétrica.

Por lo tanto, $N_A \gg N_D$.

En una juntura muy asimétrica, la capacidad está dominada por el lado menos dopado, es decir

que:

$$C_j'(V) = \sqrt{\frac{q \epsilon_s N_D}{2(\phi_B - V)}}$$

Dado que:

$$C_j'(0) = C_{j0} = \sqrt{\frac{q \epsilon_s N_D}{2 \phi_B}}$$

reemplazo con los datos:

$$29 \cdot 10^{-9} \frac{F}{\text{cm}^2} = \sqrt{\frac{1,602 \cdot 10^{-19} \text{C} \cdot 11,7 \cdot 8,85 \cdot 10^{-14} \frac{F}{\text{cm}} N_D}{2 \cdot 0,840 \text{V}}}$$

$$8,5175 \cdot 10^{15} \text{cm}^{-3} = N_D$$

Dado que:

$$\phi_B = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$

$$0,840 \text{V} = \frac{1,381 \cdot 10^{-23} \text{J/K} \cdot 300 \text{K}}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{C}} \ln \left(\frac{N_A \cdot 8,5175 \cdot 10^{15} \text{cm}^{-3}}{(6,822 \cdot 10^9 \text{cm}^{-3})^2} \right)$$

$$N_A = 6,9782 \cdot 10^{24} \text{cm}^{-3}$$

$N_A \gg N_D$ el resultado es coherente.

Finalmente:

$$\phi_p = -\frac{kT}{q} \ln \frac{N_a}{n_i} = -\frac{1,381 \cdot 10^{-23} \cdot 300K}{1,602 \cdot 10^{-19}C} \cdot \ln \left(\frac{6,9782 \cdot 10^{24}}{4,822 \cdot 10^9} \right)$$

$$\phi_p = -0,7151V = -715,1mV$$

$$\phi_n = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_d}{n_i} = \frac{1,381 \cdot 10^{-23} \cdot 300K}{1,602 \cdot 10^{-19}C} \cdot \ln \left(\frac{8,5175 \cdot 10^{11}}{4,822 \cdot 10^9} \right)$$

$$\phi_n = 0,1248V = 124,8mV$$

10. Nuevamente, al ser una P^+N muy asimétrica $N_a \gg N_d$.

$$T = 300K$$

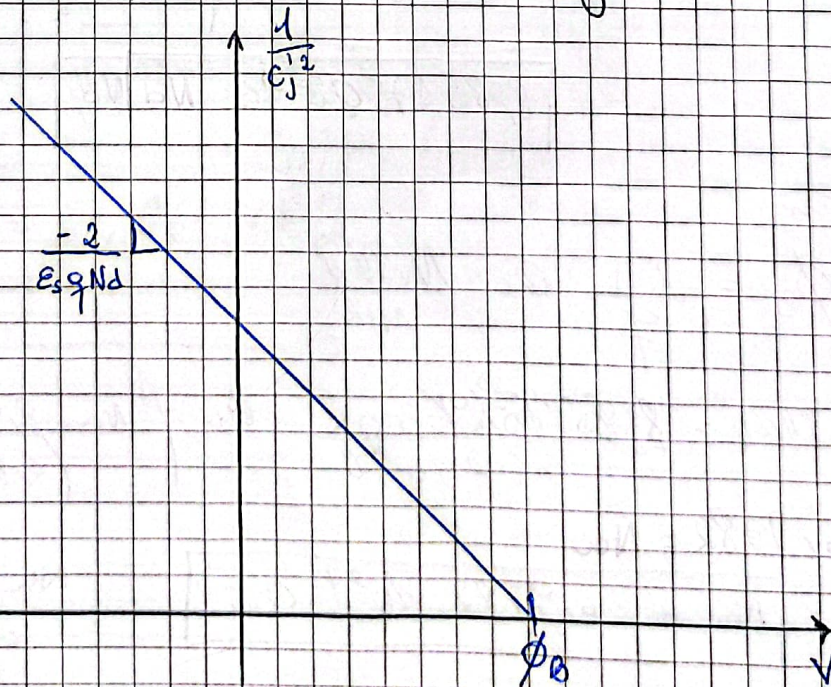
$$\phi_0 = 10,855V$$

$$m = \text{perdida} = -10^{-25} \left(\frac{F}{cm^2} \right)^{-2}$$

no de bases
no de bases
costa de la unión
si $v = \phi_0 \Rightarrow \frac{1}{C_j} = 0$

$$\frac{1}{C_j^2} \approx \frac{2(\phi_0 - V)}{q \epsilon_s N_d}$$

El gráfico se puede ver de la siguiente manera:



La pendiente vale:

$$\mu = \frac{-2}{E_s q N_d} = -10^{25} \frac{(F/cm^2)^{-2}}{V}$$

Es decir:

$$\frac{-2}{11,7 \cdot 8,8 \cdot 10^{-10} F/cm \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} C N_d} = -10^{25} \frac{(F/cm^2)^{-2}}{V}$$

$$N_d = 1,2056 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3}$$

Para obtener N_a :

$$\phi_B = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_a N_d}{N_i^2} \right)$$

reemplazando con los datos:

$$0,855 \text{ V} = \frac{1,381 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \cdot 300 \text{ K}}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}} \ln \left(\frac{1,2056 \cdot 10^{12} N_a}{(6,822 \cdot 10^9 \text{ cm}^{-3})^2} \right)$$

$$N_a = 8,8055 \cdot 10^{21} \text{ cm}^{-3}$$

• Parte III: Integradores

11. (a) Paso de conductividades a resistividades tal que

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

(DOPAJE) $\rho_N = \frac{1}{48} \Omega \text{ cm} \approx 0,020833 \Omega \text{ cm} = 2,0833 \cdot 10^{-2} \Omega \text{ cm}$

(DOPAJE) $\rho_P = \frac{1}{95,36 \cdot 10^{-3}} \Omega \text{ cm} = \frac{3925}{48} \Omega \text{ cm} \approx 65,1042 \Omega \text{ cm}$

Las conductividades son muy diferentes entre sí, observando el gráfico de resistividad en función de dopaje se pueden deducir que:

$$N_A = 2 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}; \quad N_D = 4 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$$

Dado que la diferencia entre ambas es mayor a orden 2, entonces puede afirmarse que la juntura es fuertemente asimétrica.

Se aproxima mediante el gráfico de resistividad y densidad de dopantes.

Esta es una forma de resolver el ejercicio, por esta manera es planteando las ecuaciones y despejando

$$\phi_B = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_A N_D}{(n_i)^2} \right) \quad (1)$$

$$\lambda_{do} = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s \phi_B (N_a + N_d)}{q N_a N_d}} \quad (2)$$

$$|\epsilon_0| = \sqrt{\frac{2 q \phi_B N_a N_d}{\epsilon_s (N_a + N_d)}} \quad (3)$$

Desarrollo (2):

$$2,17 \cdot 10^{-4} \text{ cm} = \sqrt{\frac{2 \cdot 11,7 \cdot 8,85 \cdot 10^{-14} \text{ F/cm} \cdot \phi_B (N_a + N_d)}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot N_a \cdot N_d}}$$

$$3,6426 \cdot 10^{-15} = \frac{\phi_B (N_a + N_d)}{N_a \cdot N_d} \quad (4)$$

Desarrollo (3)

$$6,7 \cdot 10^3 \text{ V/cm} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot \phi_B N_a N_d}{11,7 \cdot 8,85 \cdot 10^{-14} \text{ F/cm} (N_a + N_d)}}$$

$$1,4507 \cdot 10^{14} = \frac{\phi_B N_a N_d}{(N_a + N_d)}$$

$$N_a + N_d = \frac{\phi_B N_a N_d}{1,4507 \cdot 10^{14}} \quad (5)$$

Reemplazo en (4)

$$3,6426 \cdot 10^{-15} = \phi_B \cdot \phi_B \cdot \frac{N_a N_d}{1,4507 \cdot 10^{14} (N_a + N_d)}$$

$$0,5284 = \phi_B^2 \Rightarrow \phi_B = 0,72695 \text{ V} \quad (6)$$

Debe ser positivo!

Asamblea

Re-plazo (6) a (5):

$$0,72695 = \frac{1,387 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \cdot 300 \text{ K}}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}} \ln \left(\frac{N_a N_d}{(6,822 \cdot 10^9)^2} \right)$$

$$1,6435 \cdot 10^{12} = \frac{N_a N_d}{(6,822 \cdot 10^9)^2}$$

$$7,5092 \cdot 10^{34} \text{ cm}^{-6} = N_a N_d$$

$$\frac{7,5092 \cdot 10^{34}}{N_d} = N_a \quad (7)$$

Re-plazo a (4)

$$3,6426 \cdot 10^{-15} = 0,72695 \cdot \ln \left(\frac{(7,5092 \cdot 10^{34} / N_d) + N_d}{7,5092 \cdot 10^{34} / N_d} \right)$$

$$N_d^2 - 3,7629 \cdot 10^{19} N_d + 7,5092 \cdot 10^{34} = 0$$

$$N_d \rightarrow 3,7608 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3} \Rightarrow N_A = 1,9967 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_d \rightarrow 1,9966 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3} \Rightarrow N_A = 3,7608 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$

obteniendo el gráfico de resistencia en función de dopaje, el resultado correcto debe ser el primero.

(b) Punto de la aproximación de vaciamiento:

$$Q_j(V) = \sqrt{\frac{2q G_s N_a N_d (\phi_0 - V)}{N_a + N_d}} = Q_{j0} \sqrt{1 - \frac{V}{\phi_0}}$$

Nuevamente, el dato de la carga en realidad no es necesario ya que:

$$\sigma = q (m_0 \mu_n + p_0 \mu_p) \quad [(\text{cm})^{-2}]$$

y se sabe que para el lado

$$N: \quad \sigma_N = 48 (\text{cm})^{-2}$$

$$m_0 = N_D \quad (\text{encuentro a el punto (2)})$$

$$p_0 = \frac{(M_i)^2}{N_D} \quad (\text{podría despreciarse})$$

$$P: \quad \sigma_P = 75,36 \cdot 10^{-3} (\text{cm})^{-2}$$

$$m_0 = \frac{(M_i)^2}{N_A} \quad \text{y podría despreciarse}$$

$$p_0 = N_A$$

$$M_i = 6,822 \cdot 10^9 \text{ cm}^{-3} \quad \text{en Silicio}$$

De esta manera:

$$\sigma_N = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot \mu_n \cdot N_D$$

$$48 (\text{cm})^{-2} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot \mu_n \cdot 4 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$$

$$\mu_n \approx 74,90 \approx \boxed{75 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}} = \mu_n}$$

$$\sigma_p = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot \mu_p \cdot N_A$$

$$15,36 \cdot 10^{-3} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot \mu_p \cdot 2 \cdot 10^{24} \text{ cm}^{-3}$$

$$479,40 \approx \mu_p \approx 480 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}}$$

De esta manera, se obtienen las movilidads.

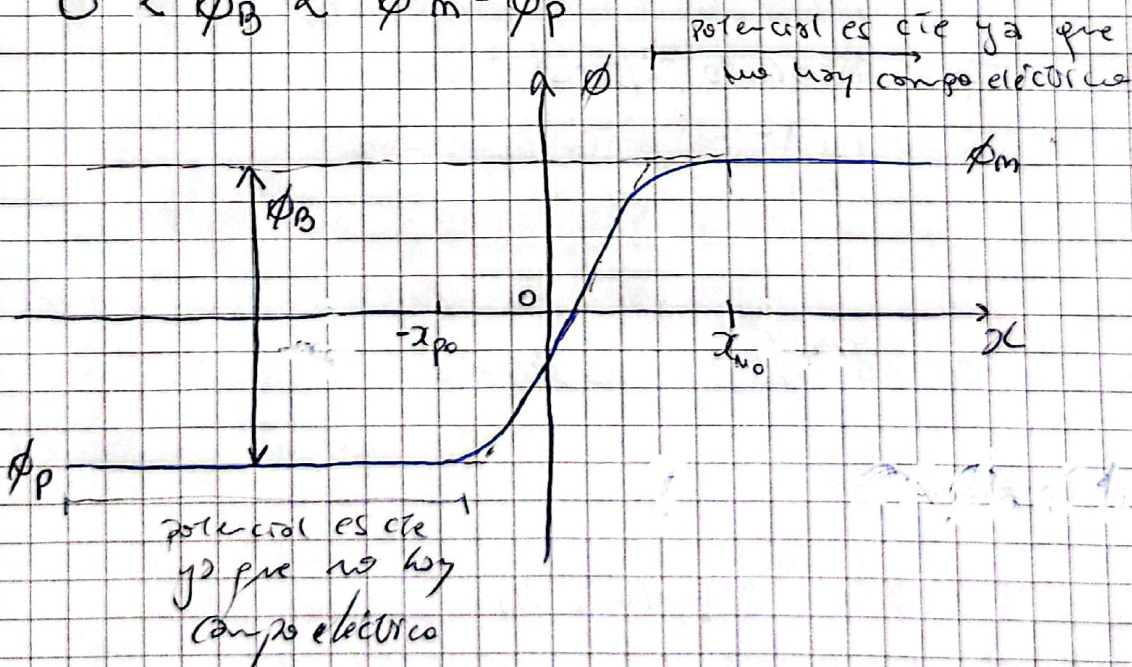
12. Silicio

$$N_A = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$$

$$T = 300 \text{ K}$$

a) ϕ_B es potencial eléctrico y es la diferencia de potencial entre ϕ_m y ϕ_p por lo cual sus límites son justamente estos. (siempre es positivo)

$$0 < \phi_B < \phi_m - \phi_p$$



En cuanto a los límites numéricos de ϕ_B , $0 < \phi_B < 1,1 \text{ V}$ ya que $\pm 550 \text{ mV}$ es la diferencia de potencial máximo que en equilibrio puede alcanzar una región P o N respecto a la intrínseca, entonces la máxima diferencia se obtiene haciendo una región P con -550 mV

de potencial y una con N con 550 mV de potencial, de forma tal que la diferencia de potencial es 1 V , ¿por qué 550 mV es el máximo? Es un hecho experimental, a partir de ciertos valores de concentración de dopantes (se podrá calcular usando la fórmula que te da el potencial en función de la densidad de dopantes y poniendo 550 mV y despejando), aunque aumentes la cantidad de dopantes no crece más de 550 mV .

$$b) |E(V)| = \sqrt{\frac{2q(\phi_0 - V) N_a N_d}{\epsilon_s (N_a + N_d)}}$$

Dado que desconocemos el valor de ϕ_0 , pero se en que rango se encuentra ϕ_0 , puede afirmarse que:

$$|V| = 45 \text{ V} \gg \phi_0 \Rightarrow \phi_0 + V \approx V$$

para el punto (a) $0 < \phi_0 < 11,1$

De esta manera, reemplazo

$$\left(3 \cdot 10^5 \text{ V/cm}\right)^2 = \frac{2 \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 45 \text{ V} \cdot 1 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3} N_d}{11,7 \cdot 8,85 \cdot 10^{-14} \text{ F/cm} \cdot (10^{18} \text{ cm}^{-3} + N_d)}$$

$$N_d \approx 6,5055 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$$

c) Es evidente, solo de observar la ecuación, ~~que~~
que si aumenta el N_D , tal que $N_D \ll N_A$
(todavía) y aumentamos $|E_0|$, por lo que
es una cosa muy sencilla.

13. a) Junctura $P^+N \rightarrow$ fuertemente asimétrica

$$N_A \gg N_D$$

domina el lado menos dopado a la electrostática de la junctura PN

Es decir que:

$$|E_0| \approx \sqrt{\frac{2q\phi_B N_d}{\epsilon_s}} \propto \sqrt{N_d}$$

$$10 \cdot 10^3 \frac{V}{cm} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} C \cdot \phi_B \cdot 4,5 \cdot 10^{14} cm^{-3}}{11,7 \cdot 8,85 \cdot 10^{-14} F/cm}}$$

$$\phi_B = 0,7181 V = 718,1 mV$$

$$\phi_m = V_{th} \ln \frac{n_0}{n_i} = \frac{kT}{q} \ln \frac{n_0}{n_i} \stackrel{qN_A \gg n_0 = n_D}{=} \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{4,5 \cdot 10^{14} cm^{-3}}{6,822 \cdot 10^9 cm^{-3}} \right) = 0,2874 V$$

$$-\phi_p = \phi_B - \phi_m = 0,7181 - 0,2874 = 0,4307 V = V_{th} \ln \frac{p_0}{n_i} = \frac{kT}{q} \ln \frac{p_0}{n_i} \rightarrow$$

$$N_A = 1,1374 \cdot 10^{17} cm^{-3} \Rightarrow \text{cumple } P^+N$$

b) El E_0 de ruptura es el máximo campo eléctrico que puede soportar un medio sin que se rompa el aislamiento.

El dieléctrico hace que el campo eléctrico en el interior de un condensador sea menor que ϵ_m dieléctrico

$$190 \cdot 10^3 \frac{V}{cm} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} C \cdot \phi_B \cdot 4,5 \cdot 10^{14} cm^{-3}}{11,7 \cdot 8,85 \cdot 10^{-14} F/cm}} \Rightarrow \phi_B = 207,5496 V$$

VALOR ABSURDO!

ϕ_B nunca puede exceder 0,7 V (para una oblea de Si cristal.) Para una junctura PN: $0 \leq \phi_m \leq 550 mV$

$$\phi_B \text{ m\u00f3x} = \phi_{m\u00f3x} = \phi_{p \text{ m\u00f3x}} = 1,4 V \ll 207 V \quad 0 \geq \phi_p \geq -550 mV$$

$L_{ND} = 10^{20} cm^{-3} \rightarrow N_A = 10^{20} cm^{-3}$ } para $\phi_B \text{ m\u00f3x} = 287 - (550 mV) = 837 mV$ Asamblea

c)

Verifco 1: (con junctions muy asimétricas):

$$170 \cdot 10^3 \frac{V}{\mu\text{m}} \rightarrow \sqrt{\frac{2 \cdot q \cdot \phi_B \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}}{11,7 \cdot 8,85 \cdot 10^{-14} \frac{\text{F}}{\text{cm}}}} \Rightarrow 9,339 \text{ V} > \phi_B$$

$$\phi_m = V_{th} \ln\left(\frac{N_A}{N_i}\right) = 427,36 \text{ mV} \Rightarrow \phi_p = 506,54 \text{ mV} > -880 \text{ mV}$$

$$\frac{-506,54}{1000} = -V_{th} \ln\left(\frac{N_D}{N_i}\right) \Rightarrow N_D = 2,1263 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3} < 1 \cdot 10^{20} \text{ cm}^{-3}$$

valor máximo

d) El ancho total de la región de carga espacial se define como

$$x_{do} = x_{no} + x_{po} = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s \phi_B (N_A + N_D)}{q N_A N_D}}$$

Se puede observar que a mayores concentraciones de dopantes x_{do} disminuye.

Para obtener la densidad volumétrica de carga

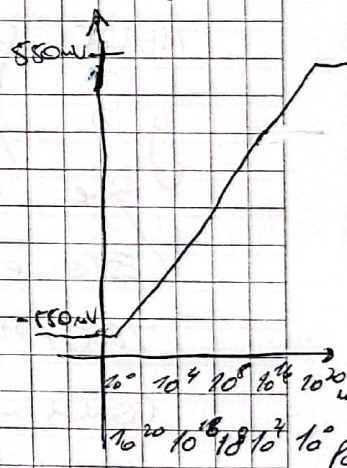
$$\rho(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -x_{po} \\ -qN_A & \text{si } -x_{po} < x < 0 \\ qN_D & \text{si } 0 < x < x_{no} \\ 0 & \text{si } x_{no} < x \end{cases}$$

Para obtener el campo eléctrico debe integrar la densidad volumétrica, por lo que, al tener una mayor densidad de carga volumétrica el campo eléctrico será mayor:

$$E(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -x_{p0} \\ -\frac{qN_A}{\epsilon_s} (x+x_{p0}) & \text{si } -x_{p0} < x < 0 \\ \frac{qN_D}{\epsilon_s} (x-x_{n0}) & \text{si } 0 < x < x_{n0} \\ 0 & \text{si } x_{n0} < x \end{cases}$$

Finalmente, para obtener el potencial eléctrico, integro el campo eléctrico, de forma tal que:

$$\phi(x) = \begin{cases} \phi_p & \text{si } x < -x_{p0} \\ \frac{qN_A}{2\epsilon_s} (x+x_{p0})^2 + \phi_p & \text{si } -x_{p0} < x < 0 \\ -\frac{qN_D}{2\epsilon_s} (x-x_{n0})^2 + \phi_n & \text{si } 0 < x < x_{n0} \\ \phi_n & \text{si } x_{n0} < x \end{cases}$$

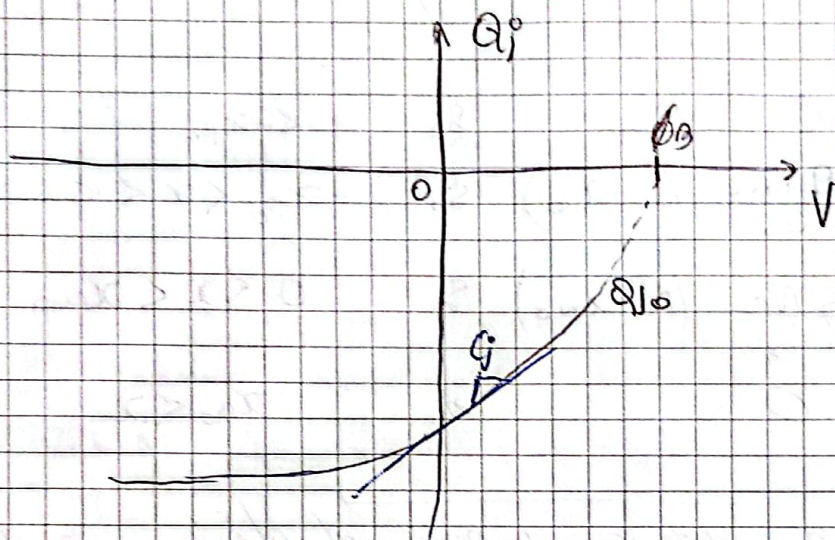


De esta manera, cuanto menor sea x , $(x+x_{p0})$ y $(x-x_{n0})$ serán mayores, es decir, que a mayor distancia implicará un mayor campo eléctrico, siempre y cuando la concentración de portadores vaya en aumento y se mantenga el potencial.

14. (a) La capacidad es la pendiente de la curva Q_j vs. V , es decir:

$$C_j = \frac{dQ_j}{dV}$$

Gráfico cualitativo.



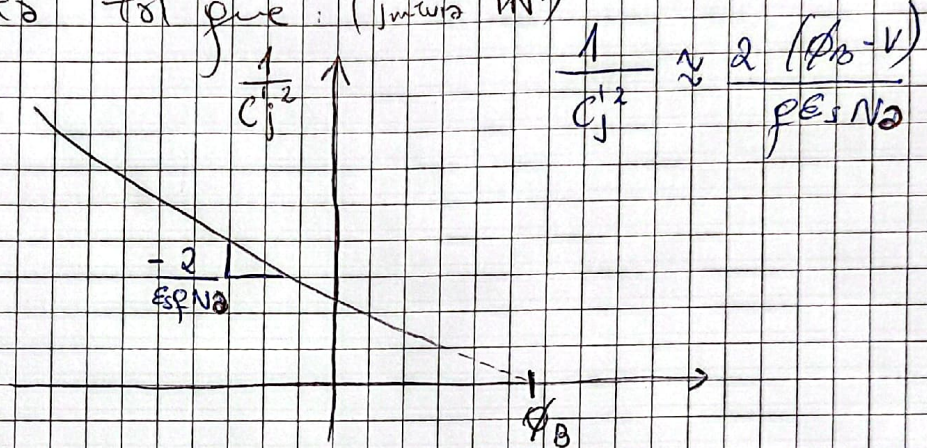
Notar que la curva se va haciendo horizontal y la pendiente es cada vez menor a medida que el potencial disminuye.

Esto se debe a que al aumentar la tensión inversa, la zona desértica SCR comienza a disminuir puesto que se modifica (zona de vacante) el dipolo de carga en la zona desértica (SCR) de modo de compensar el potencial forzado externamente.

(b) ϕ_j corta el eje horizontal.

$$\text{Se da cuando } \phi_j(v) = 0 \Rightarrow \phi_B = v$$

Con los valores de la tabla se puede hacer una recta tal que: (mirar PV+)



$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1)$$

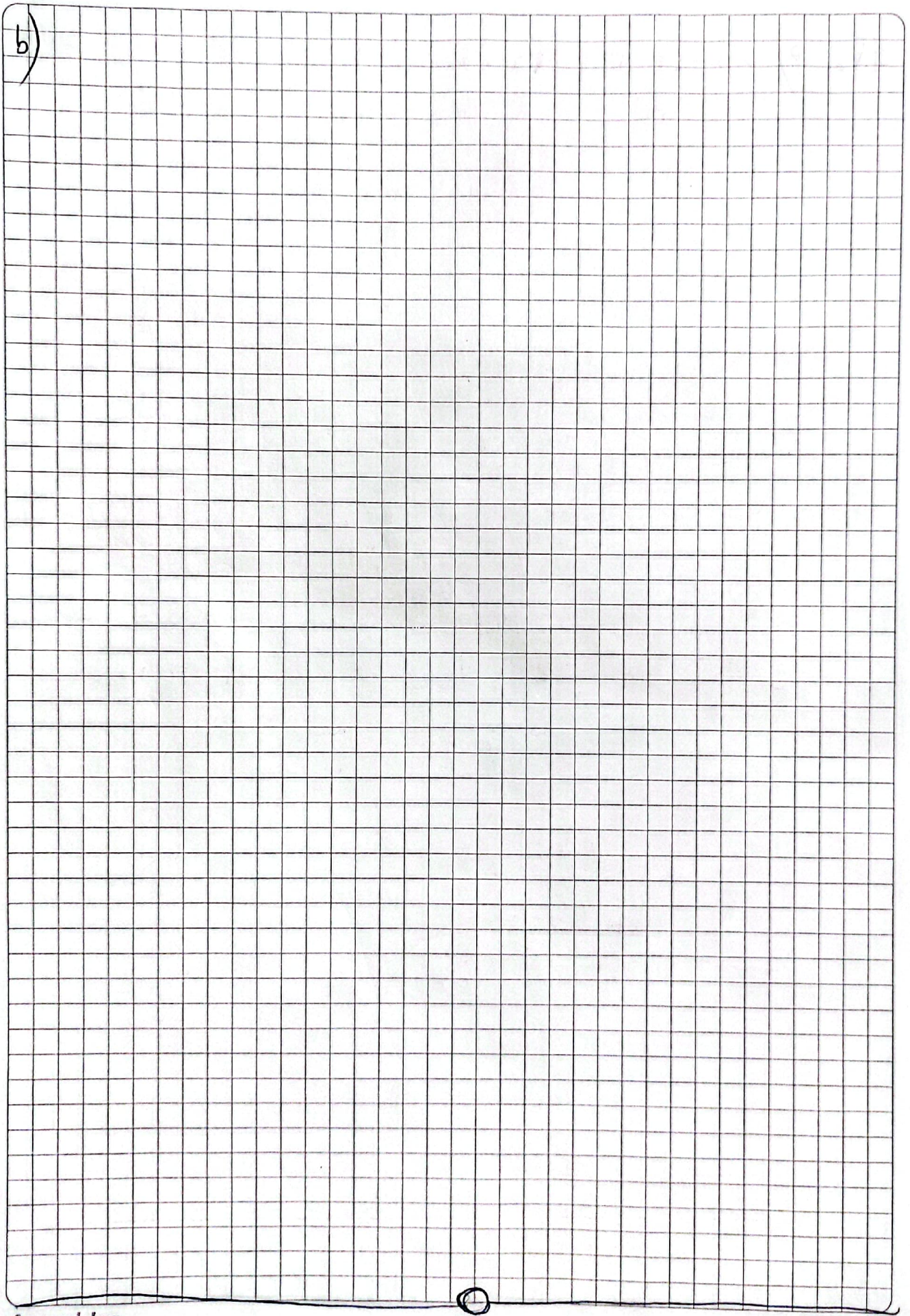
$$c_j - 3,6 = \frac{2,6 - 3,6}{-2 - (-4)} (v - (-1))$$

$$c_j = v + 4 + 3,6$$

$$c_j = v + 4,6$$

--	--

b)



Asamblea.

